

EXTREME SURFACE

1nm

Nouvel équipement ToF-SIMS

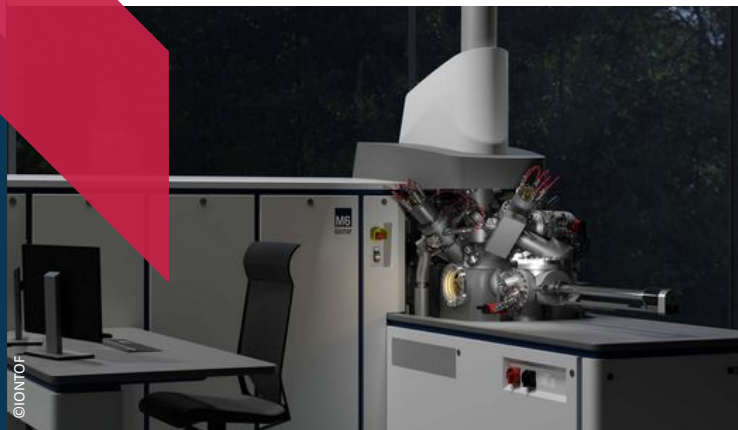
Le ToF-SIMS est une technique d'analyse d'extrême surface par spectroscopie de masse qui permet d'identifier les composants chimiques d'un matériau à l'échelle nanométrique. Ce nouvel appareil offre une haute résolution spatiale, une grande sensibilité et permet une analyse détaillée de la surface de l'échantillon.

Notre **équipement de pointe** permet

- d'identifier la composition d'une pollution de surface
- de déterminer précisément l'origine de la défaillance
- de valider l'intégrité d'un traitement ou d'une fonctionnalisation de surface

CARACTÉRISTIQUES IONTOF M6

- Profondeur d'information de 1 nm
- Résolution spatiale élevée (jusqu'à 50 nm)
- Identification atomique ou moléculaire
- Une sensibilité élevée jusqu'au PPM
- Pour tout type de matériaux (même durs)
- Profilage par agrégat d'Argon
- Profil dans l'épaisseur et les multicouches
- Cartographie 3D
- Coupe FIB 45°
- Une grande polyvalence



©IONTOF

Maîtrise de l'équipement,
Interprétation des résultats
Accompagnement vers la solution

Efficacité, Qualité, Solution

Novembre 2023



MATERIA
NOVA Materials
R&D Center

Contact :

caracterisations@materianova.be

www.materianova.be

©IONTOF